

TerraSpec[®]4

HI-RES



TerraSpec4 HI-RES

可进行快速，精准的矿物勘探

作为地质研究领域内的顶尖产品，TerraSpec系列矿物分析仪已被看做矿物分析的设备。TerraSpec 4 Hi-Res矿物分析仪的光谱分辨率可达6nm，高度便携且坚固耐用，同时扩展无线通讯功能，可帮助用户比以往更快地确定矿物勘探靶区。这款设备在SWIR 1和SWIR 2范围内性能得到了增强，采集光谱数据更快速、更准确，对于深色矿物样品尤其适应。

- 增强型光学元件提供了更加精确的光谱结果，增加光谱的清晰度。
- SWIR1/SWIR2光谱范围内的性能得到了2倍的提升，可更好的进行蚀变矿物分析。
- 高度便携（新款背包和标配的802.11g WiFi），用户可在勘探现场轻松行动。
- 无损测量，提高了野外扫描的速度。

独特应用

- 矿物勘查
- 矿床测绘
- 矿物成分鉴定
- 钻屑分析
- 岩芯编录
- 早期探矿



对于矿采地质学家来说，设备性能的提升意味着更快的数据采集速度和更高质量的数据。性能的增强使得其可用于测量低密度和低反射率的矿物，比如之前难以测量的含铁矿物（如蛇纹石和绿泥石）。TerraSpec 4 Hi-Res矿物分析仪已经被广泛用于一系列矿物的勘探，包括矿床测绘。

规格

性能参数

波长范围	350-2500 nm
光谱分辨率	3nm @ 700 nm 6nm @ 1400/2100 nm
扫描时间	100ms
信号噪声比(N/S)	
VNIR	9000:1 @ 700 nm
SWIR 1	9000:1 @ 1400 nm
SWIR 2	4000:1 @ 2100 nm
杂散光	
VNIR	5000:1 (0.02%)
NIR	10000:1 (0.01%)
波长重现性	0.1nm
波长准确性	0.5nm
通道数	2151
VNIR检测器	(350-1000nm) 512 Si阵列
SWIR 1 & SWIR 2检测器	(1001-1800nm) & (1801-2500nm) 阶梯折射InGaAs光电二极管，TE 制冷

认证及许可

CE认证	EN61010-1:2001 第二版
欧盟指令	2006/95/EC, 2004/108/EC

NIST可追踪式校对
WEEE兼容

通讯

有线	10/100 Base T以太网端口，以太网 交叉电缆
无线	802.11g无线网卡

物理参数和使用环境

尺寸(H×W×D)	12.7 × 36.8 × 29.2 cm
主机重量	5.44 kg
电池重量	1.2kg
电池运行时间	约6小时（未接光源或其他附件）
工作温度	0~40 °C
存储温度	-15~45 °C
输入电源	AC/DC开关电源和密封铅酸胶体 电池
AC输入	90-240VAC, 50/60Hz
DC输入	12VDC, 60W
辅助端口电源	输出，+12VDC, 27Watt（最大）

其它配置

软件	RS3™光谱采集软件（同SpecMin 地学软件兼容）ViewSpec™Pro后 处理软件，可选Indico® Pro软件
携带装置	坚固的仪器运输箱，可定制的野外背 包（含软质旅行包）
质保	一年免费保修，包括专家的客户支持
电脑	Windows®7 64位笔记本电脑（仪器 控制器）

STS 北京咏归科技有限公司
Beijing STS Instrument Co., Ltd.

地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦A座502
邮编：100085 电话：010 — 82780599
传真：010 — 82782455 邮箱：sales@ststek.com

客服热线
4000-188-698
WWW.YONGGUITECH.COM